PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-098917

(43)Date of publication of application: 13.06.1983

(51)Int.CI.

H01L 21/205

H01L 21/263

(21)Application number: 56-197858

(71)Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

09.12.1981

(72)Inventor:

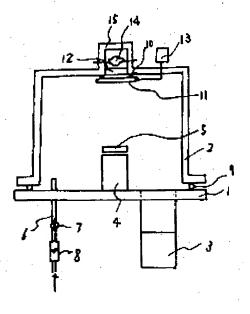
IWAMATSU SEIICHI

(54) ATOMIC LAYER EPITAXIAL DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To permit a rapid epitaxial growth at low temperature by providing a lamp which illuminates the specimen surface.

CONSTITUTION: A vacuum vessel is constituted by a base plate 1, bell-jar 2 and a vacuum pump 3. A specimen holder 4 for holding a specimen 5 such as a wafer is disposed in the vacuum vessel. A gaseous compound such as SiCl containing atoms (Si) for the epitaxial growth is introduced into the vacuum vessel through a gas inlet section 6. A lamp 14 of a lamp section is adapted to illuminate at least the surface of the specimen 5. The lamp section is composed of the constituents such as a light shutter 11, quartz window 12, shutter driving motor 13, mercury lamp 14 and a lamp house 15. According to this arrangement, the epitaxial growth is performed in two steps of adsorption of gas by the base plate and decomposition of the compound by the application of light.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭58—98917

①Int. Cl.³ H 01 L 21/205

識別記号

庁内整理番号 7739-5F 6851-5F 砂公開 昭和58年(1983)6月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

切原子層エピタキシャル装置

21/263

願 昭56-197858

②出 願 昭56(1981)12月9日

⑩発 明 者 岩松誠一

②特

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

個代 理 人 弁理士 最上務

明 組 書

1 発明の名称 原子層エピタキシヤル装置

2 特許請求の範囲

真空容器内には試料保持がなされ、かつ、 該真空容器内にエピタキシャル成長させるための原子を含むガス化合物の導入部が設けられ、かつ、少なもとも試料表面を光照射するランプが設けられた事を特徴とする原子層エピタキシャル装置。

3. 発明の評細な説明

本発明は、原子装置エピタキシャル装置に関する。

兼近、T. Santo(a, J. Antson, A. Pakka(a and S. Lindfors, "Atomic Layer Epitaxy for Producing EL-Thin Films,",1980 S/D International Symposiam, Digest of Technical Papers, P. P. 108-109, Apr. 1980.

に示される如く、真空容器内の試料表面にガス吸 着を1階づつ行ない、該ガス吸着層を選元するこ とにより1原子層のエピタキシャル層成長が可能 となつた。

しかるに、前配従来技術では、試料基板の加熱を要する事および2種のガス導入を要するなど、処理時間を要し、低温成長が不可能等の欠点があった。

本発明は、かかる従来技術の欠点をなくし、高速でかつ低温の原子順エピタキンヤル収長が可能 な装置を提供することを目的とする。

上配目的を選成するための本免明の基本的な構成は、其空容器内には試料保持がなされ、かつ、 該真空容器内にエピタキシャル放長させるための 原子を含むガス化合物の導入部が設けられ、かつ 少なくとも試料表面を光照射するランプが設けられた事を特象とする。

以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。 第1図は、本発明による原子層エピタキシャル 装置の一実施例を示す。1は真空容器支持基板、 2 はペルシャー、 3 は真空ポンプ、 4 は試料台、 5 は 8 1 ウェーハ等の試料、 6 はガス導入口であり、7 はパルプ、 8 は流量計である。

この反応を、従来の方式による反応との対比で 今少し詳細にのべると、従来技術では、第2図に 示すごとく、81ウエーハ基板上に81原子を1

5 …真空ポンプ

4 … 餀科台

5 … 試 料

6 …ガス導入口

7…ドルブ

8 …洗量計

9,10 ... パッキン

11…シャツター

1 2 … 石英熔

13…モーター

14…水銀ランプ

15…ランプ・ハウス。

以上

出順人 株式会社 諏訪 精工 會

代理人 弁理士 最上



層エピタキシャル成長させる場合、(a) 8 1 基本上への 8 1 C & 。 吸着、(b) 8 1 C & 。 吸着層上への B 層 映着、(c) B C & 除去の 3 工程が基板 温度を常温~ 3 0 0 もの範囲で制御しなが 6 行なわれるのに対し、本発明では、第 3 図に示すごとく、(a) 8 1 基板上への 8 1 C & 。 吸着、(b) 光照射による B 1 0 & 。 分解による C & ガス除去の 2 工程が常温から 1 0 0 で以下で行なわれる。

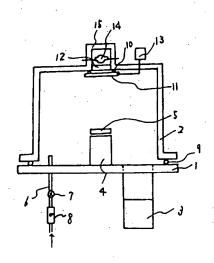
上記の如く、本発明による原子層エピタキシャル装置では、反応工程が短縮され、高速で原子層エピタキシャル処理ができると共に、常温で原子脂エピタキシャルが可能となる効果がある。

4 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例を示す原子層エピ タキシャル装飾の概略図である。第2図は、従来 の原子層エピタキシャル反応、第3図は、本発明 による原子層エピタキシャル反応を模式的に示し たものである。

1 … 真空容器基板

2 …ペンジャー



第1日第

(A)
$$\frac{c! - s_{1} - c!}{s_{1} - c!} \frac{c!}{c! - s_{1} - c!} \frac{c!}{c!} \frac{c!}{c!} \frac{c!}{c!} \frac{c!}{s_{1}} \frac{c!}{c!} \frac{c!}{s_{1}} \frac{c!}{s_{1}}$$

$$\downarrow \qquad \longrightarrow Hcl$$
(c) $\underline{si} \quad \underline{si} \quad \underline{si} \quad \underline{si}$
 $\underline{si} \quad \underline{si} \quad \underline{si}$

第 2 团

第 3 図